

樹脂中のナノフィラーの分散状態解析 — 小角X線散乱 (SAXS) —

概要

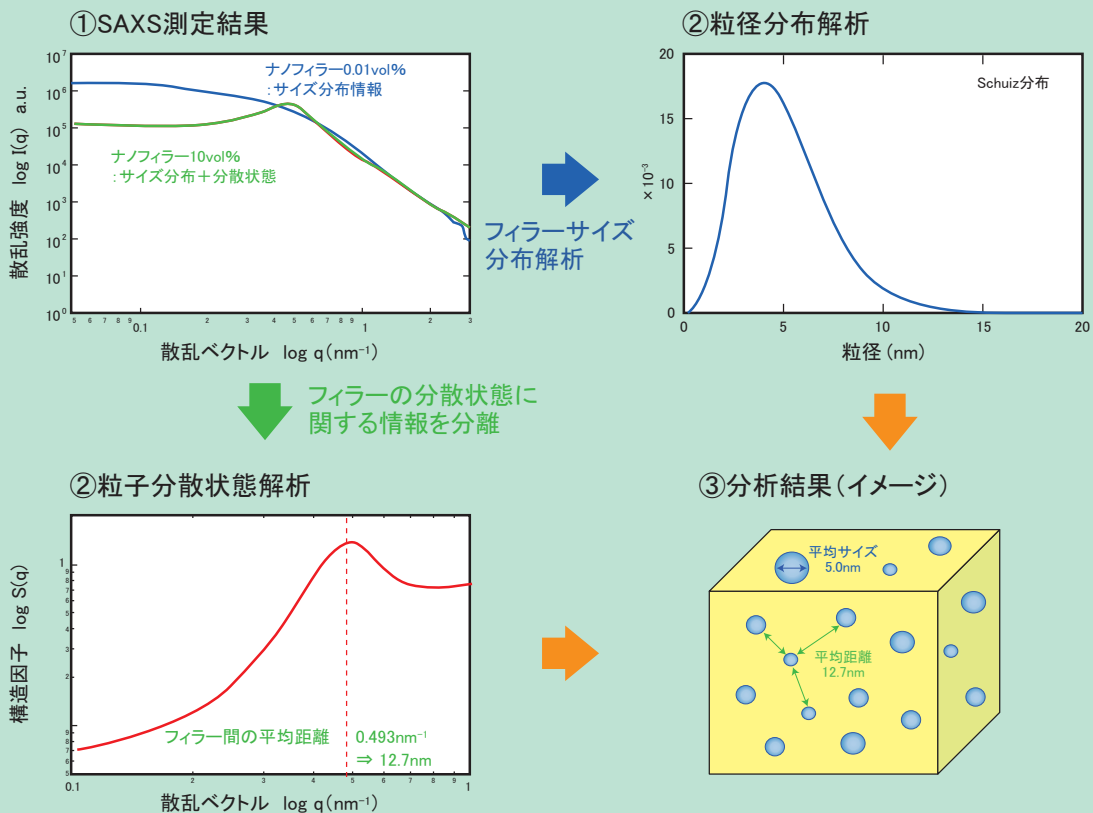
小角X線散乱(SAXS)法はナノサイズ材料を分析する有効な方法で、樹脂成型品やフィルム中であっても1~100nmの粒径分布や分散状態(平均距離)を評価することができる。

● 粒子分散の状態解析手法の比較

	SAXS	SEM・TEM	動的光散乱・粒度分布測定法
粒子サイズ	nm	(nm~) μm	サブμm
粒子サイズ情報	3次元情報	2次元情報	3次元情報(マトリックスは透明)
粒子間平均距離	◎	○(2次元情報)	×

● ナノフィラーの分散状態解析事例

SAXSプロファイルを解析し、球状ナノフィラーのサイズ分布、分散状態(平均距離)を評価



株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎03-5524-3851